

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2005 年 12 月 22 日 (22.12.2005)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2005/121739 A1

- (51) 国際特許分類⁷: G01M 11/00, G01R 31/26
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2004/007971
- (22) 国際出願日: 2004 年 6 月 8 日 (08.06.2004)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 株式会社アドバンテスト (ADVANTEST CORPORATION) [JP/JP]; 〒1790071 東京都練馬区旭町一丁目 3 2 番 1 号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 菊池 裕之 (KIKUCHI, Hiroyuki) [JP/JP]; 〒1790071 東京都練馬区旭町一丁目 3 2 番 1 号 株式会社アドバンテスト内 Tokyo (JP). 新浜 舟一 (SHINHAMA, Shuichi) [JP/JP];

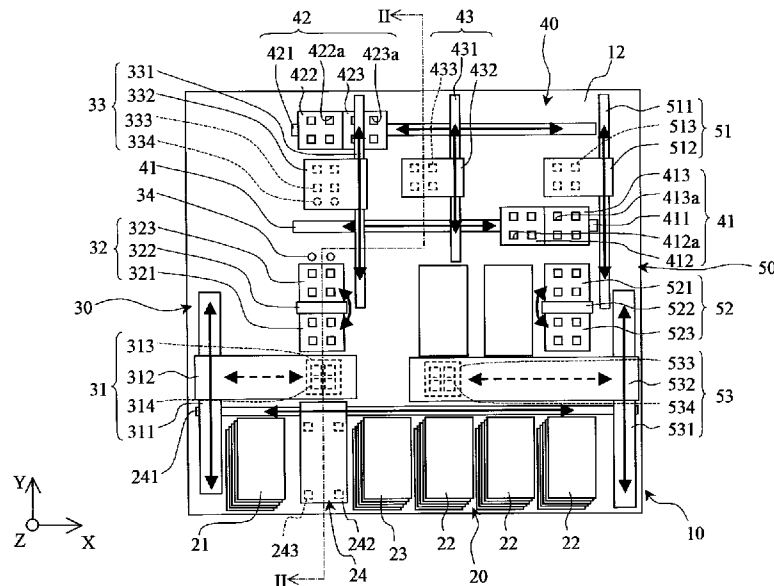
〒1790071 東京都練馬区旭町一丁目 3 2 番 1 号 株式会社アドバンテスト内 Tokyo (JP).

- (74) 代理人: 前田 均 (MAEDA, Hitoshi); 〒1010051 東京都千代田区神田神保町 1 丁目 1 - 1 7 東京堂神保町第 3 ビル 2 階 前田・西出国際特許事務所 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD,

/ 続葉有 /

(54) Title: IMAGE SENSOR TEST EQUIPMENT

(54) 発明の名称: イメージセンサ用試験装置



(57) Abstract: An image sensor test equipment (10) performs test of the optical characteristics of an image sensor by bringing the I/O terminal of the image sensor into contact with the contact part (61) of a test head (60) and inputting an electrical signal from the contact part (61) of the test head (60) to the I/O terminal of the image sensor or from the I/O terminal of the image sensor to the contact part (61) of the test head (60) while irradiating the light receiving surface of the image sensor with light from a light source unit (80). The image sensor test equipment comprises a loader inverter (32) for inverting the image sensor carried into a supply tray stocker (21) while directing the light receiving surface upward, a contact arm (43) for moving the image sensor while grasping the back surface of the image sensor on the side opposite to the light receiving surface and bringing the image sensor into contact with the contact part (61) of the test head (60) while directing the light receiving surface downward, and an unloader inverter for inverting the tested image sensor and carrying it out.

/ 続葉有 /

WO 2005/121739 A1



SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(57) 要約: イメージセンサの入出力端子をテストヘッド(60)のコンタクト部(61)に接触させ、イメージセンサの受光面に光源装置(80)から光を照射しながらテストヘッド(60)のコンタクト部(61)からイメージセンサの入出力端子に電気信号を入出力することにより、イメージセンサに対して光学的特性の試験を行うイメージセンサ用試験装置(10)は、受光面が上方を向いた姿勢で供給トレイ用ストッカ(21)に搬入されたイメージセンサを反転させるローダ用反転装置(32)と、イメージセンサの受光面とは反対側の背面を把持して、イメージセンサを移動させ、受光面を下方に向けた状態でイメージセンサをテストヘッド(60)のコンタクト部(61)に接触させるコンタクトアーム(43)と、試験済みのイメージセンサを反転させて搬出するアンローダ用反転装置と、を備えている。